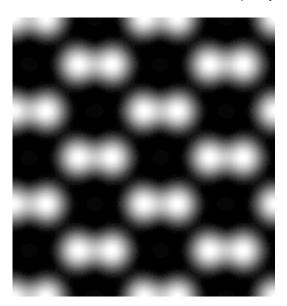


STEM

for MacHREMTM/WinHREMTM

Scanning Transmission Electron Microscope Image Simulation Program

走査型透過電子顕微鏡像 シミュレーションプログラム



GaAs [011] の HAADF 像

このプログラムは走査型透過電子顕微鏡像を計算するもので、高分解能電子顕微鏡像のシミュレーションのためのプログラムである *MacHREM™ / WinHREM™* の拡張機能として追加されたものです。明視野像、暗視野像、さらに最近注目されています高角度散乱暗視野像 (HAADF STEM) を計算することができます。

● 使いやすいユーザインターフェース

初心者でも容易にデータ作成、計算の実行を行う

● 信頼のおけるアルゴリズム

MacHREM[™]ヱばが飛ばまず採用されているマルチスライス法

にもとずく動力学的散乱計算を基本としています。

● 高品位な画像出力

Mac OS / Windows の標準画像フォーマットで高品位な濃淡像を生成し、印刷、他のアプリケーションへのコピーが可能です。

お問い合わせ先

有限会社 HREM (HREM Research Inc.)

〒355-0055 埼玉県東松山市松風台 14-48 TEL/FAX 0493-35-3919

email: support@hremresearch.com



文献: K. Ishizuka: A practical approach for STEM image simulation based on the FFT multislice method, Ultramicroscopy 90 (2001) 71-83.